上海新进芯微电子有限公司

2017-10-12

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海新进芯微电子有限公司

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目基本概况:

本项目建成后主要用于: 6英寸0.35-0.5微米CMOS/BiCMOS/BCD工艺的集成电路芯片制造, 产能2万片/月; 8英寸0.25微米CMOS/BiCMOS/BCD工艺的集成电路芯片制造, 产能2万片/月。

地理位置及周边环境描述:

上海市闵行区紫星路1600号

评价项目组长 王磊 技术负责人 谷丰

过程控制负责人 张劲智 报告编制人 王磊

审核人 谷丰 项目组成员 张婧、谢泽陶

第一次现场调查的目的和任务:

目的: 现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料, 与企业进行沟通。

任务: 现场实地调查, 资料收集。

结果: 收集资料, 确定检测方案。

现场调查与检测

现场调查人员: 王磊、张婧 时间: 2017年5月31日

第二次现场检测的目的和任务:

目的: 进行现场职业病危害因素检测。任务: 进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写, 缺乏资料的补充。

结果: 完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员: 王磊 时间: 2017年5月24日

评价报告完成时间: 2017年7月24日